



Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1

tel.: 0420 221 624 111, podatelna@sujb.cz

datová schránka: me7aazb

Schválená metodika

Metodika použití zobrazovací XRF analýzy v kombinaci s APM-SIMS pro stírané vzorky jaderných materiálů

Organizace žadatele:

Centrum výzkumu Řež, s.r.o.

Název programu, název a číslo projektu: ...

Program TAČR BETA2, název projektu Pokročilý proces mapování rozložení uranu ve stíraných vzorcích pro zárukové účely, číslo projektu TITSSUJB315

Autoři:

RNDr. Jan Lorinčík, CSc.,
Mgr. Kristína Sihelská,
Ing. Daniela Veselá, Ph.D.,
Ing. Hana Paterová, Ph.D.,
Ing. Ivan Elantjev,
Ing. Jan Gut,

Organizace:

Centrum výzkumu Řež, s.r.o.

Prof. doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.,
Prof. doc. Tomáš Čechák, CSc.,
Ing. Pavel Novotný, Ph.D.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Oponenti:

Vlastimil Miler, MBA

Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.

Organizace:

ÚJV Řež, a.s.

SÚJCHBO, v.v.i.

Rok uplatnění metodiky: 2025

Abstrakt:

Cílem metodiky jsou analýzy stíraných vzorků pro podporu kontrolní činnosti SÚJB a dalších národních a mezinárodních orgánů v oblasti systému jaderných záruk pomocí zdokonalené metody oproti doposud používanému postupu. Tohoto cíle je dosaženo integrací systému rentgenové fluorescenční analýzy (XRF), který poskytne přehledovou informaci o rozložení uranu ve stěru, do měřicí trasy APM-SIMS. Zdokonalení analýz kombinované metody XRF-APM-SIMS je jak kvalitativní – snížení pravděpodobnosti nesprávných výsledků, tak kvantitativní – snížení průměrné doby analýz v porovnání s doposud v České republice používanou metodikou APM-SIMS.

Seznam dokumentů:

1. Metodika použití zobrazovací XRF analýzy v kombinaci s APM-SIMS pro stírané vzorky jaderných materiálů
2. Osvědčení o uznání uplatněné schválené metodiky